2015. Том 56, № 4

Июль

C. 698 – 701

УДК 54.165:546.161:543.429.23

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ В СИСТЕМЕ BiF₃—KF—ZrF₄

В.Я. Кавун, Е.Б. Меркулов, М.М. Полянцев, Р.М. Ярошенко, В.К. Гончарук

Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия E-mail: kavun@ich.dvo.ru

Статья поступила 14 июля 2014 г.

Методами ДСК, РФА и ЯМР ¹⁹F исследованы фазовые переходы и ионная подвижность в твердых растворах (ТР) с флюоритовой структурой (100–*x*)КВіF₄—*x*ZrF₄, где *x* = 2,5— 10 мол.%. Установлено наличие фазовых переходов в твердых растворах, содержащих 10 % ZrF₄. Определены виды ионных движений во фторидной подрешетке ТР и интервалы температур, в которых они реализуются (150—570 К). Установлено наличие высокой ионной проводимости в этих твердых растворах (~10⁻³—10⁻² См/см в области температур 475—550 К), что не исключает возможности их использования для получения материалов с высокими ионпроводящими свойствами.

DOI: 10.15372/JSC20150406

Ключевые слова: твердые растворы с флюоритовой структурой, ионная подвижность, фазовые переходы, спектры ЯМР¹⁹F, спектры ДСК, рентгенофазовый анализ.

Интерес к неорганическим фторидам с высокими электрофизическими свойствами обусловлен возможностью получения на их основе новых функциональных материалов, находящих применение в различных электрохимических устройствах, конденсаторах, батареях и др. [1—5]. В качестве твердых электролитов могут быть использованы фторсодержащие твердые растворы с флюоритовой структурой, которые характеризуются высокой фтор-ионной проводимостью [6—10]. Особое внимание привлекают твердые электролиты на основе BiF₃, поскольку выше 400—490 K они обладают высокой ионной проводимостью ~10⁻² См/см. Интенсивное исследование систем, содержащих BiF₃, начатое в конце 70-х годов прошлого столетия [11—13], продолжается и в последние годы [14—17]. При этом во многих исследованиях с успехом используется спектроскопия ЯМР [16—21].

С целью поиска твердых растворов с высокой ионной подвижностью и проводимостью в системе BiF₃—KF—ZrF₄ был синтезирован и исследован методами РФА, ДСК и ЯМР ряд твердых растворов с флюоритовой структурой состава $yBiF_3$ —yKF— $xZrF_4$, где x = 2,5—10 мол.%. Ранее в этой системе в области составов с высоким содержанием ZrF₄ нами была изучена ионная подвижность и электрофизические свойства стекол, проводимость которых при температурах выше 490 К достигает значений ~10⁻⁴ См/см [22].

Согласно данным РФА, при 2,5 % содержании ZrF₄ в образце образуется твердый раствор с параметрами ячейки, близкими к параметрам для твердого раствора 40KF—60BiF₃ [23]. С увеличением концентрации ZrF₄ до 5 мол.% параметры ячейки твердого раствора и соединения KBi₃F₁₀ довольно близки [23]. В образце, содержащем 10 мол.% ZrF₄, кроме фазы близкой по параметрам к соединению KBi₃F₁₀, появляется фаза (менее 3 %), которую однозначно иден-

[©] Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Полянцев М.М., Ярошенко Р.М., Гончарук В.К., 2015



Рис. 1. ДСК кривые нагревания для твердых растворов 48,75BiF₃—48,75KF—2,5ZrF₄ (I), 47,5BiF₃—47,5KF—5ZrF₄ (II) и 45BiF₃—45KF—10ZrF₄ (III)

тифицировать по данным РФА затруднительно. По данным ДСК (рис. 1) при нагревании этого образца наблюдается два фазовых перехода: первый — выше 487 К обладает сильным гистерезисом (обратный переход происходит через сутки после охлаждения образца) и второй (обратимый) выше 555 К. По температурам эти два эндоэффекта близки к эндоэффектам, характерным для соединения K₂ZrF₆.

Спектры ЯМР ¹⁹F твердых растворов состава 48,75ВiF₃—48,75КF—2,5ZrF₄ (I), 47,5BiF₃— 47,5KF—5ZrF₄ (II) и 45BiF₃—45KF—10ZrF₄ (III), характеризующихся разнообразным термическим поведением в интервале температур 300-673 К, представлены на рис. 2 и 3. В связи с отсутствием плато на температурной зависимости второго момента спектров ЯМР образцов I—III в области 200—150 К следует предположить, что жесткая решетка для фторидной подсистемы в этих ТР реализуется ниже 150 К. Наблюдаемая трансформация спектров ЯМР в области температур 150—300 К (см. рис. 2, 3) обусловлена появлением локальной подвижности во фторидной подрешетке рассматриваемых твердых растворов. Начальная температура этого процесса определяется концентрацией тетрафторида циркония в образце. Если для образцов с x = 2,5 и 5 мол.% спектр ЯМР начинает трансформироваться выше 190 К, то для твердого раствора III выше 220 К. В спектрах ЯМР твердых растворов I и II появление относительно узкой компоненты с химическими сдвигами (XC) 109 и 112 м.д. наблюдается при температуре 220 К. При этом бо́льшую площадь занимает узкая линия в спектре ЯМР образца І. При 250 К на долю основных узких компонент в спектрах ЯМР образцов I и II приходится более 55 % общей площади спектра, тогда как площадь узкой линии в спектре твердого раствора III не превышает 4 % (данные компьютерного моделирования спектров ЯМР). Локальными движениями во фторидной подрешетке могут быть реориентации висмутсодержащих группировок, поскольку наблюдаемые величины ХС близки к значению 112 м.д., характерному для ромбической фазы ВіF₃. С другой стороны, учитывая, что для флюоритовых твердых растворов с избытком фторанионов в бинарных системах BiF₃—MF_n характерно наличие разных фторидных подрешеток, то не исключено, что регистрация в спектрах ЯМР узкой компоненты (наряду с реориентациями висмутсодержащих группировок) вызвана появлением обмена между ионами фтора, принадлежащих разным фторидным подсистемам (ионы фтора в нормальных (кубических) и интерстициальных позициях). Такое заключение было сделано, например, при исследовании твердых растворов с флюоритовой структурой Na_{1-x}Bi_xF_{1+2x} [20], Cd_{1-x}Bi_xF_{2+x} [18] и др. [23, 24]. С повышением температуры до 450 К интенсивность обменных процессов растет, что приводит к сужению спектров ЯМР твердых растворов с x = 2,5,5 и 10 мол.% до 1,2 кГц и уменьшению второго момента до значений меньше 0,05 Гс². При этом XC основных резонансных линий (104—111 м.д., см. рис. 2, 3) близки к значениям ХС, характерных для спектров ЯМР твердых растворов в системе BiF₃—KF (105—111 м.д.) [16]. Регистрируемые значения параметров спектров ЯМР (форма линии, ее ширина и второй момент) с учетом данных [16] свидетельствуют о главенствующей роли трансляционной диффузии в твердых растворах с x = 2.5, 5 и 10 мол.% ZrF₄ в области температур 350—400 К.





Рис. 2. Спектры ЯМР ¹⁹F твердых растворов I, II при вариациях температуры ($v_0 = 282,404$ МГц, XC относительно C₆F₆)

Рис. 3. Спектры ЯМР ¹⁹F твердого раствора **Ш** при разных температурах ($v_0 = 282,404$ МГц)

Спектры ЯМР ¹⁹F всех рассматриваемых твердых растворов выше 500 K, кроме основной компоненты с XC 108—116 м.д., содержат вторую компоненту с разной шириной и интенсивностью с XC 126 м.д. для ТР I и II и 144 м.д. для ТР III (см. рис. 2, 3).

Для образцов I и II интенсивность этой компоненты не превышает 4 и 7 % соответственно, от общей площади спектра ЯМР ¹⁹F при 450 K, а ее ширина уменьшается до ~5 и 2,5 кГц. Поскольку согласно данным РФА образцы I и II представляют собой однофазные твердые растворы, то наличие этого сигнала в спектрах ЯМР может указывать на наличие примеси в образце, в качестве которой возможно выступает KBi₃F₁₀ (XC = 120 м.д., T = 400 K). При охлаждении образцов (450 (570) \rightarrow 300 K) спектр ЯМР практически совпадает со спектром ненагретых твердых растворов I и II при 300 K.

В спектрах ЯМР ¹⁹F твердого раствора с x = 10 мол.% вторая компонента с XC ≈ 144 м.д. в отличие от спектров ЯМР твердых растворов I и II появляется только выше 490 К (после первого ФП) и после второго ФП (см. рис. 1) ее площадь составляет ≈ 20 % от общей площади спектра при 570 К (ширина линий соответственно равна 1,2 и 2,8 кГц) — рис. 3. Новую компоненту, по-видимому, следует отнести к метастабильной модификации, которая сохраняется при охлаждении образца от 570 до 300 К. При этом сам спектр моделируется тремя компонентами, одна из которых с XC 146 м.д., вероятно, принадлежит метастабильной модификации, а две других с XC 110 и 71 м.д. — исходной фазе (см. рис. 3). Следует отметить, что сравнительно большая интенсивность компоненты с XC 146 м.д. в спектре ЯМР охлажденного образца, вероятнее всего, связана с ее наложением на третью компоненту от исходной фазы (XC 143 м.д. см. рис. 3). Через двое суток спектр ЯМР образца III приобретает форму исходного (до нагрева) спектра твердого раствора (300 К), что находится в хорошем согласии с данными ДСК.

Учитывая данные ЯМР ¹⁹F для твердых растворов в системе BiF₃—KF—ZrF₄ и результаты измерений ионной проводимости в твердых растворах в системах BiF₃—KF и BiF₃—KF—MF_n

[6, 7, 16, 23, 24], можно ожидать, что электропроводность исследованных твердых растворов должна быть не хуже 10^{-4} — 10^{-2} См/см выше 500 К. Предварительные данные по измерению ионной проводимости показывают, что величина удельной проводимости σ зависит от содержания ZrF₄ в образце. Так, в образце 45BiF₃—45KF—10ZrF₄ она равна $\sim 3 \times 10^{-3}$ См/см при 550 K, тогда как в образце 48,75BiF₃—48,75KF—2,5ZrF₄ — $1,6 \times 10^{-2}$ См/см уже при 475 К. При этом наблюдается определенная зависимость величины σ от состава образца при одинаковом содержании в нем ZrF₄: чем больше в составе образца фторида калия, тем выше проводимость. Таким образом, не исключена возможность использования твердых растворов в этих системах для получения функциональных материалов с высокими электрофизическими свойствами.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-03-00041).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Reddy M.A., Fichtner M. // J. Mater. Chem. 2011. 21. P. 17059 17062.
- 2. Amatucci G.G., Pereira N. // J. Fluor. Chem. 2007. 128. P. 243 262.
- 3. Patro L.N., Hariharan K. // Solid State Ion. 2013. 239. P. 41 49.
- 4. Ishii T. // Solid State Ion. 2009. 180. P. 441 445.
- 5. Bouazza S., Saberi A., Willert-Porada M. // Mater. Lett. 2011. 65. P. 1334 1336.
- 6. Réau J.M., Hagenmuller P. // Rev. Inorg. Chem. 1999. 19. P. 45 77.
- 7. Berastegui P., Hull S. // Solid State Ion. 2002. **154-155**. P. 605 608.
- 8. *Бучинская И.И., Федоров П.П. //* Успехи химии. 2004. **73**. С. 404 434.
- 9. Трновцова В., Федоров П.П., Фурар И. // Электрохимия. 2009. **45**. С. 668 678.
- 10. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела: В 2 т. Том 2. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010.
- 11. Lucat C., Rhandour A., Réau J.M. et al. // J. Solid State Chem. 1979. 29. P. 373 377.
- 12. *Réau J.M., Portier J., Levasseur A. et al.* // Mat. Res. Bull. 1978. **13**. P. 1415 1423.
- 13. *Réau J.M., Grannec J., Lucat C. et al.* // J. Fluor. Chem. 1982. **19**. P. 363 368.
- 14. Prituzhalov V.A., Abakumov A.M., Ardashnikova E.I. et al. // Mater. Res. Bull. 2007. 42. P. 861 869.
- 15. Réau J.M., Wahbi M., Sénégas J., Hagenmuller P. // J. Fluor. Chem. 2009. 54. P. 169.
- 16. Kavun V.Ya., Uvarov N.F., Ulihin A.S. et al. //Solid State Ion. 2012. 225. P. 645 648.
- 17. Кавун В.Я., Уваров Н.Ф., Телин И.А. и др. // Неорган. материалы. 2013. **49**. С. 1247 1251.
- 18. Suh K., Senegas J., Reau J.M., Hagenmuller P. // J. Solid State Chem. 1991. 93. P. 469 484.
- 19. El Omari M., Réau J.M., Sénégas J. et al. // J. Fluor. Chem. 2002. 113. P. 37 45.
- 20. El Omari Malika, Hafidi E., El Omari Mohamed. et al. // Mater. Lett. 2002. 53. P. 138 144.
- 21. Soo S.K., Senegas J., Réau J.M. et al. // J. Solid State Chem. 1993. 104. P. 215 225.
- 22. Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Синебрюхов С.Л. и др. // Неорган. материалы. 2009. 45. С. 358 365.
- 23. Soubeyroux J.L., Réau J.M., Matar S. et al. // Solid State Ion. 1982. 6. P. 103 111.
- 24. Matar S., Réau J.M., Lucat C. et al. // Mater. Res. Bull. 1980. 15. P. 1295 1301.